



D Z I E N N I K N O R M A L I Z A C J I I M I A R

Warszawa, dnia 20 marca 1981 r.

Nr 4

Treść:
poz.:

ZARZĄDZENIA PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI MIAR I JAKOŚCI

16 — nr 30 z dnia 27 lutego 1981 r. o zatwierdzeniu typów małych kompletów płytek kątowych o symbolu MLAh i dużych o symbolu MLAk, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie	77
17 — nr 31 z dnia 27 lutego 1981 r. o zatwierdzeniu typów transametrow o symbolu MMCf, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS w Warszawie	79
18 — nr 32 z dnia 27 lutego 1981 r. o zatwierdzeniu typów mikromierzy czujnikowych z czujnikiem wbudowanym o symbolu MMCc, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie	80
19 — nr 33 z dnia 27 lutego 1981 r. o zatwierdzeniu typu mikroskopów kontrolnych o symbolu fabrycznym MK, wytwarzanych przez Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie	81
20 — nr 34 z dnia 27 lutego 1981 r. zmieniające zarządzenie o zatwierdzeniu typu kątomierzy uniwersalnych z noniusem 5' o symbolu MKMb, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie	82

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

21 — z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia o ustanowieniu, zmianach i unieważnieniu Polskich Norm oraz o unieważnieniu norm branżowych	83
--	----

16

ZARZĄDZENIE NR 30

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

z dnia 27 lutego 1981 r.

o zatwierdzeniu typów małych kompletów płytek kątowych o symbolu MLAh i dużych o symbolu MLAk, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie (4,11153 Wr 327/1 i 4,11153 Wr 328/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Zatwierdza się zestawione w tablicy typy kompletów płytek kątowych, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie.

Lp.	Symbol kompletu	Znak typu
1	Mały — MLAh	PRL T Wr 327
2	Duży — MLAk	PRL T Wr 328

2. Kompletom płytek kątowych nadaje się znaki typu podane w tablicy.

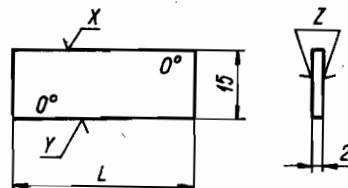
3. Płytki kątowe powinny być wytwarzane zgodnie z wymaganiami PN-64/M-53108 oraz dokumentacją konstrukcyjną.

Zakres stosowania

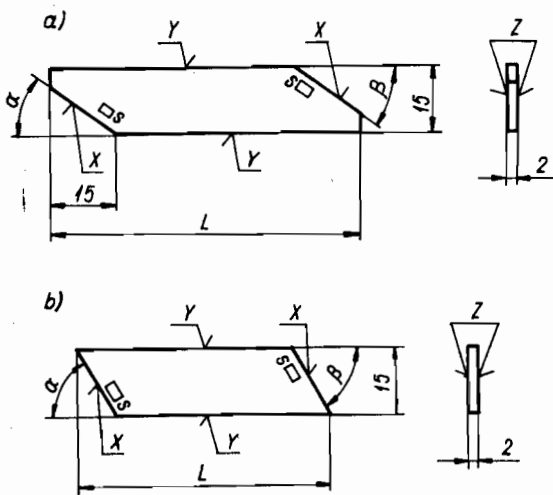
§ 2. Płytki kątowe stosowane są jako wzorce kątów.

Opis konstrukcji

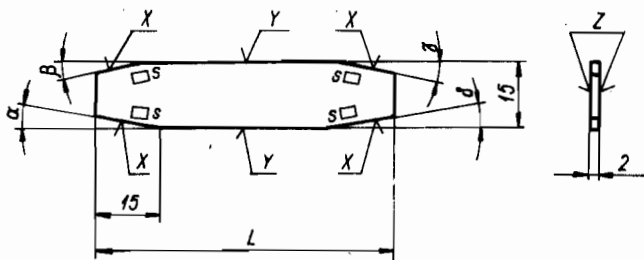
§ 3.1. Poszczególne rodzaje płytek kątowych są przedstawione na rys. 1, 2 i 3. Komplet płytek kątowych duży o symbolu MLAk jest przykładowo przedstawiony na rys. 4.



Rys. 1 Płytki prostoliniowa

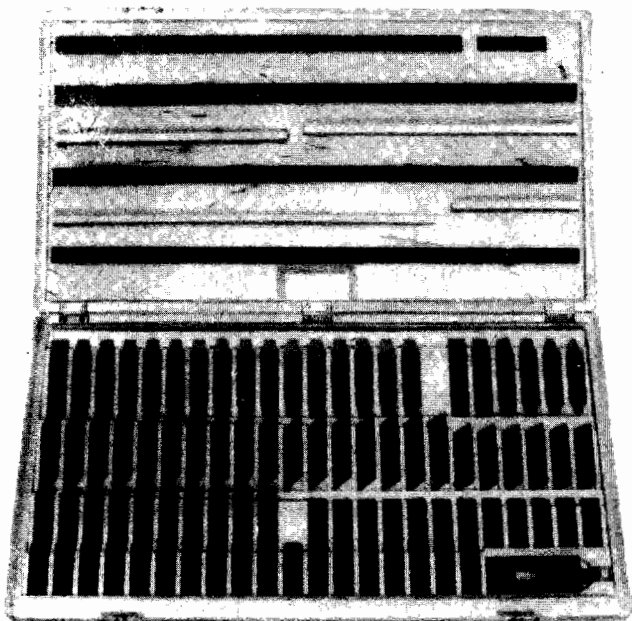


Rys. 2 Płytki z dwoma kątami pomiarowymi a) przy α i β do 45° ,
b) przy α i β do 45°



Rys. 3 Płytki z czterema kątami pomiarowymi
Oznaczenia na rysunkach 1, 2 i 3:

X — powierzchnie pomiarowe skośne, Y — powierzchnie pomiarowe równoległe, Z — powierzchnie boczne, S — miejsce cechowania wymiaru nominalnego kąta mierniczego



Rys. 4 Komplet płytek kątowych dużych o symbolu MLAK

2. Komplet mały o symbolu MLAh zawiera 49 płytek kątowych i pozwala na pomiar kątów:

- 1) od 0° do 10° ze stopniowaniem kąta co 1° ,
- 2) od 10° do 350° ze stopniowaniem kąta co $5'$,
- 3) od 350° do 360° ze stopniowaniem kąta co 1° .

3. Komplet duży o symbolu MLAk zawiera 85 płytek kątowych i pozwala na pomiar kątów:

- 1) od 0° do 10° ze stopniowaniem kąta co 1° ,
- 2) od 10° do 350° ze stopniowaniem kąta co $1'$,
- 3) od 350° do 360° ze stopniowaniem kąta co 1° .

4. Płytki kątowe powinny być odmagnesowane.
5. Wszystkie płytki kątowe kompletu powinny być umieszczone w trwałym wspólnym opakowaniu, a każda płytka kąтовая powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami przez umieszczenie w osobnym gnieździe.

6. Do każdego kompletu płytek kątowych powinien być dołączony specjalny uchwyt umożliwiający łączenie dwóch płytek kątowych.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne płytek kątowych są następujące:

- 1) chropowatość powierzchni
 - a) pomiarowych $R_z \leq 0,2 \mu\text{m}$,
 - b) bocznych $R_a \leq 0,63 \mu\text{m}$,
- 2) graniczny dopuszczalny błąd płaskości $0,5 \mu\text{m}$,
- 3) graniczny dopuszczalny błąd równoległości powierzchni pomiarowych równoległych $1 \mu\text{m}/40 \text{mm}$,
- 4) graniczny dopuszczalny błąd prostopadłości powierzchni pomiarowych względem powierzchni bocznych $4'$,
- 5) graniczne dopuszczalne błędy kątów pomiarowych $\pm 12''$,
- 6) twardość powierzchni pomiarowych min 62 HRC.

Postanowienia końcowe

§ 5. Komplet płytek kątowych mogą być wytwarzane do dnia 31 grudnia 1984 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości
wz. T. Podgórski

17

ZARZĄDZENIE NR 31

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

z dnia 27 lutego 1981 r.

o zatwierdzeniu typów transametrów o symbolu MMCf, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie
(4,132 Wr 331/1 ÷ 4,132 Wr 334/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Zatwierdza się zestawione w tablicy typy transametrów o symbolu MMCf, wytwarzanych przez Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS” w Warszawie.

Lp.	Symbol	Zakres pomiarowy w mm	Znak typu
1	MMCf	0 ÷ 25	PRL T Wr 331
2	MMCf	25 ÷ 50	PRL T Wr 332
3	MMCf	50 ÷ 75	PRL T Wr 333
4	MMCf	75 ÷ 100	PRL T Wr 334

2. Transametrom nadaje się znaki typu podane w tablicy.

3. Transametry powinny być wytwarzane zgodnie z wymaganiami PN-75/M-53250 i PN-75/M-53259 oraz dokumentacją konstrukcyjną.

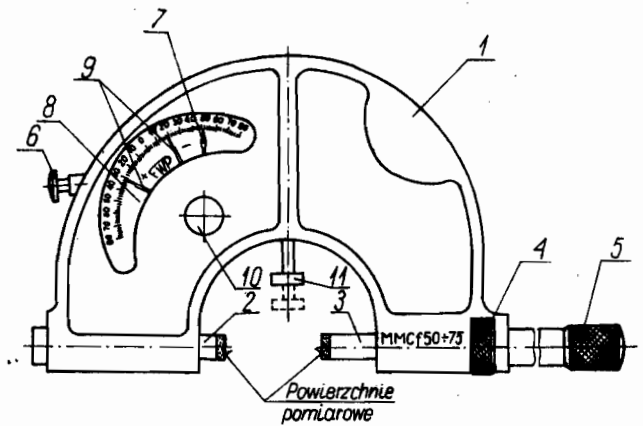
Zakres stosowania

§ 2. Transametry służą do pomiarów odchyłek zewnętrznych długości.

Opis konstrukcji

§ 3.1. W transametrze kowadełko 2 jest sprzężone z czujnikiem wbudowanym w korpus 1. Powierzchnie pomiarowe kowadełka i wrzeciona powinny być do siebie równoległe i przeciwległe w każdym położeniu wrzeciona 3. Wrzeciono przesuwają się za pomocą nakrętki nastawczej 4, a unieruchamiają za pomocą zacisku 5. W swobodnym stanie kowadełka 2, tzn. przy zwolnionej dźwigni 6 wskazówka 7 czujnika powinna znajdować się poza podziałką tarczy po stronie wskazań ujemnych. Dwa nastawne wskaźniki tolerancji 9 można nastawić niezależnie od siebie w całym zakresie

pomiarowym podziałki po odkręceniu nakrętki 10. Nie powinny one samoczynnie zmieniać swego położenia. Transametry o dolnej granicy zakresu pomiarowego ≥ 25 mm powinny mieć dwa wymienne trzpienie oporowe 11.



Transametr o symbolu MMCf i zakresie pomiarowym 50 mm ÷ 75 mm:
1 — korpus, 2 — kowadełko, 3 — wrzeciono, 4 — nakrętka nastawcza, 5 — zacisk, 6 — dźwignia wyłącznikowa, 7 — wskazówka, 8 — tarcza z podziałką, 9 — wskaźniki tolerancji, 10 — nakrętka, 11 — trzpień oporowy

2. Powierzchnie pomiarowe wrzeciona i kowadełka są wykonane z węglików spiekanych wg PN-76/H-89500.

3. Transametry powinny być odmagnesowane.

4. Każdy transametr powinien znajdować się w pudełku zabezpieczającym go przed uszkodzeniem.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne transametrów są następujące:

- 1) chropowatość powierzchni pomiarowych $R_a \leq 0,040 \mu\text{m}$,
- 2) graniczny dopuszczalny błąd płaskości powierzchni pomiarowych wrzeciona i kowadełka $0,6 \mu\text{m}$,
- 3) graniczny dopuszczalny błąd równoległości powierzchni pomiarowych:
 - a) dla transametrów o zakresie pomiarowym 0 ÷ 25 mm i 25 mm ÷ 50 mm $1 \mu\text{m}$,
 - b) dla transametrów o zakresie pomiarowym 50 mm ÷ 75 mm i 75 mm ÷ 100 mm $1,6 \mu\text{m}$,
- 4) zmienność wskazań czujnika $0,5 \mu\text{m}$,

- 5) graniczne dopuszczalne błędy wskazań:
- w zakresie 10 działek elementarnych $\pm 1 \mu\text{m}$,
 - w zakresie 40 działek elementarnych $\pm 2 \mu\text{m}$,
- 6) nacisk pomiarowy między powierzchniami pomiarowymi $5 \text{ N} \div 10 \text{ N}$,
- 7) zakres pomiarowy tarczy czujnika $\pm 80 \mu\text{m}$,
- 8) wartość działki elementarnej podziałki tarczy czujnika $2 \mu\text{m}$.

Postanowienia końcowe

§ 5. Transametry mogą być wytwarzane do dnia 31 grudnia 1984 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości
wz. *T. Podgórski*

18

ZARZĄDZENIE NR 32

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

z dnia 27 lutego 1981 r.

o zatwierdzeniu typów mikromierzy czujnikowych z czujnikiem wbudowanym o symbolu MMCc, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie (4,132 Wr 329/1 i 4,132 Wr 330/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Zatwierdza się typy mikromierzy czujnikowych z czujnikiem wbudowanym o symbolu MMCc i zakresie pomiarowym $0 \div 25 \text{ mm}$ oraz $25 \text{ mm} \div 50 \text{ mm}$, zwanych dalej mikromierzami, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie.

2. Mikromierzom o zakresie pomiarowym $0 \div 25 \text{ mm}$ nadaje się znak typu *PRL T Wr 329*, mikromierzom o zakresie pomiarowym $25 \text{ mm} \div 50 \text{ mm}$ znak typu *PRL T Wr 330*.

3. Mikromierze powinny być wytwarzane zgodnie z wymaganiami: PN-75/M-53258, PN-75/M-53259 i PN-72/M-53200.

Zakres stosowania

§ 2. Mikromierze służą do pomiarów zewnętrznych. Wbudowany czujnik umożliwia wyznaczanie odchyień

w zakresie $\pm 20 \mu\text{m}$ przy nastawieniu śruby mikrometrycznej na określony wymiar nominalny.

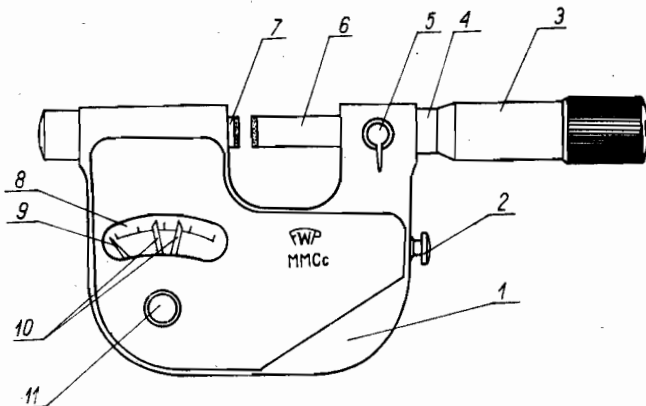
Opis konstrukcji

§ 3.1. W mikromierzu kowadełko 7 jest sprzężone z czujnikiem wbudowanym w kabłąk 1. W swobodnym położeniu kowadełka 7 wskazówka 9 czujnika powinna znajdować się poza podziałką tarczy od strony malejących wskazań. Dwa nastawne wskaźniki tolerancji 10 można nastawiać niezależnie od siebie w całym zakresie pomiarowym podziałki. Nie powinny one samoczynnie zmieniać swego położenia. Przed przypadkowym przestawieniem zabezpiecza je nakrętka 11.

2. Powierzchnie pomiarowe powinny być wykonane z węglików spiekanych według PN-76/H-89500.

3. Mikromierze powinny być odmagnesowane.

4. Każdy mikromierz powinien mieć opakowanie zabezpieczające go przed uszkodzeniem.



Mikromierz czujnikowy z czujnikiem wbudowanym o symbolu MMCc: 1 — kabłąk, 2 — dźwignia wyłącznikowa, 3 — bęben, 4 — tuleja z podziałką, 5 — zacisk, 6 — wrzeciono, 7 — kowadełko, 8 — tarcza z podziałką, 9 — wskazówka, 10 — wskaźniki tolerancji, 11 — nakrętka

Dane techniczne i metrologiczne

§ 4. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne mikromierzy są następujące:

- 1) wartość działki elementarnej na podziałce bębna 0,01 mm,
- 2) wartość działki elementarnej czujnika 0,002 mm,
- 3) zmienność wskazań czujnika 0,5 μm ,
- 4) graniczny dopuszczalny błąd wskazań czujnika:
 - a) w zakresie 10 działek elementarnych $\pm 1 \mu\text{m}$,
 - b) w zakresie 40 działek elementarnych $\pm 2 \mu\text{m}$,
- 5) chropowatość powierzchni pomiarowych $R_a \leq 0,040 \mu\text{m}$,
- 6) graniczny dopuszczalny błąd płaskości powierzchni pomiarowych 0,6 μm ,
- 7) graniczny dopuszczalny błąd równoległości powierzchni pomiarowych 1 μm ,
- 8) graniczny dopuszczalny błąd wskazań dla dolnej granicy zakresu pomiarowego zespołu mikrometrycznego + 1 μm lub - 1 μm ,

- 9) graniczne dopuszczalne błędy wskazań zespołu mikrometrycznego $\pm 3 \mu\text{m}$,
- 10) różnica błędów wskazań spowodowana unieruchomieniem wrzeciona za pomocą zacisku max 0,3 μm ,
- 11) różnica błędów wskazań, spowodowana odkształceniem kabłąka mikromierza na skutek działania między powierzchniami pomiarowymi siły $P = 10 \text{ N}$ max 1 μm ,
- 12) nacisk pomiarowy między powierzchniami pomiarowymi 5 N ÷ 10 N.

Postanowienia końcowe

§ 5. Mikromierze mogą być wytwarzane do dnia 31 grudnia 1984 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości
wz. T. Podgórski

19**ZARZĄDZENIE NR 33****PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI**

z dnia 27 lutego 1981 r.

o zatwierdzeniu typu mikroskopów kontrolnych o symbolu fabrycznym MK, wytwarzanych przez Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie
(4,1344 Wr 147/2)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Zatwierdza się typ mikroskopów kontrolnych o symbolu fabrycznym MK, zwanych dalej „mikroskopami kontrolnymi” wytwarzanych przez Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie.

2. Mikroskopom kontrolnym nadaje się znak typu PRL T Wr-147.

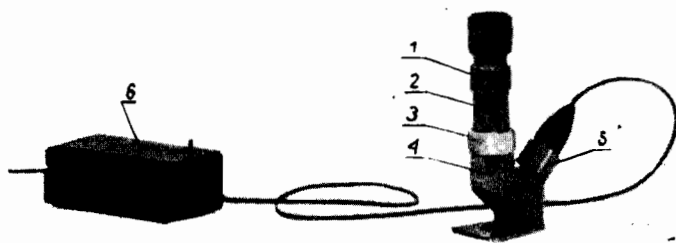
3. Mikroskopy kontrolne powinny być wytwarzane zgodnie z przedstawionym wzorem (świadczeniem typu zatwierdzonego) i dokumentacją techniczną oraz spełniać wymagania podane w świadectwie sprawdzenia wystawionym przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

Zakres stosowania

§ 2. Mikroskopy kontrolne służą do pomiarów długości w zakresie pomiarowym od 0 ÷ 8 mm z niedokładnością $\pm 0,05 \text{ mm}$ (np. do pomiarów średnic odciśnięć przy pomiarze twardości metodą Brinella), do pomiarów promieni łuków w zakresie pomiarowym od 0,1 mm do 6,0 mm oraz do pomiarów promieni okręgów w zakresie pomiarowym od 0,1 mm do 3,5 mm i do pomiarów kątów: 15°, 22° 30', 30°, 45°, 55°, 60°.

Opis konstrukcji

§ 3. Główne części mikroskopu kontrolnego przedstawia rysunek.



Mikroskop kontrolny o symbolu fabrycznym MK produkcji Polskich Zakładów Optycznych: 1 — okular, 2 — tubus, 3 — pierścień zaciskowy, 4 — korpus, 5 oświetlacz, 6 — zasilacz Z5

§ 4. Mikroskop kontrolny może być stosowany z oświetlaczem podłączonym do sieci przez zasilacz Z5 220/110 V-3,5 V lub z oświetlaczem podłączonym do zasobnika z baterią (bateria 1,5 V typu R 14).

Przy korzystnym oświetleniu i odpowiednim ustawieniu mikroskop kontrolny może być stosowany bez oświetlacza.

W zależności od rodzaju dokonywanych pomiarów w gniazdo tubusa 2 wkłada się, po uprzednim odkręceniu okularu 1, odpowiednią płytkę ogniskową z podziałką milimetrową lub z zarysami promieni okręgów, łuków, kątów, następnie nakłada się ponownie okular i dokręca się go do oporu.

Dane techniczne i metrologiczne

§ 5. Podstawowe dane techniczne mikroskopów kontrolnych są następujące:

- 1) powiększenie mikroskopu 25X,
- 2) zakres pomiarowy długości (0 ÷ 8) mm,
- 3) zakres pomiarowy promieni okręgów (0,1 ÷ 3,5) mm,
- 4) zakres pomiarowy promieni łuków (0,1 ÷ 6,0) mm,

- 5) wartość mierzonych kątów 15°, 22° 30', 30°, 45°, 55°, 60°,

- 6) wartość działki elementarnej podziałki długości 0,05 mm.

§ 6. Graniczne błędy dla mikroskopów kontrolnych są następujące:

- 1) płytką ogniskową z podziałką:
 - a) błąd podziałki w całym zakresie pomiarowym ±20 μm,
 - b) błąd podziałki w zakresie działki elementarnej ±10 μm,
- 2) płytką ogniskową z zarysami kątów: błąd kąta o wartości nominalnej 30°, 55°, 60°, ±2',
- 3) płytką ogniskową z zarysami promieni i kątów:
 - a) błąd promieni o wartości nominalnej (0,1 ÷ 3,5) mm, ±10 μm,
 - b) błąd kąta o wartości nominalnej 15°, 22° 30', 30°, 45°, ±2',
- 4) płytką ogniskową z zarysami łuków: błąd promieni o wartości nominalnej (0,1 ÷ 6,0) mm ±10 μm,
- 5) powiększenie obiektywu: błąd powiększenia obiektywu 2X ±5%.

Postanowienia końcowe

§ 7. Mikroskopy kontrolne mogą być wytwarzane do dnia 31 grudnia 1982 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości
wz. T. Podgórski

20

ZARZĄDZENIE NR 34

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

z dnia 27 lutego 1981 r.

zmieniające zarządzenie o zatwierdzeniu typu kątomierzy uniwersalnych z noniusem 5' o symbolu MKMb, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie (4,1391 Wr 135/1,1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21, z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285 i z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 119 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 28 lipca 1973 r. o zatwierdzeniu typu kątomierzy uniwersalnych z noniusem 5' o symbolu MKMb, wytwarzanych przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świerczewskiego w Warszawie (Dz. Norm. i Miar nr 35, nr klas. metrolog. 4,1391 Wr 135/1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Kątomierze mogą być wytwarzane do dnia 31 grudnia 1984 r.“

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości
wz. T. Podgórski